

膜厚測定システム FilmSmart



特徴

測定範囲: 200Å~400,000Å

波長範囲: 380~850nm

屈折率 n ・減衰係数 k 、透過・反射・色測定も可能

小型・軽量 付属ソフトで簡単測定

自動XYステージ: 2次元、3次元描画(オプション)

構成

CCD 分光器、光源 (380~900nm)、集光系、

ノート PC(ソフト込み)、10 x 10 cm ステージ

測定対象

SiO₂、NO_x、ITO、フォトレジスト、TiO₂、多結晶シリコン、

ポリイミド、Nb₂O₅、サファイア基板の窒化ガリウム、

ガラス、シリコン、Al、Cr、PET、PLED など

HMTEK 社(台湾)の FilmSmart は、膜厚、屈折率 n /減衰係数 k 、透過/反射率、色すべてを測定できる膜厚測定システムです。CCD 分光器、光源、ステージ、ファイバ集光系、パソコン、ソフトウェア一体型で、面倒な作業・設定は一切必要なく、簡単に表面・薄膜測定できます。分光器、光源やステージなどオプション豊富で、小型・軽量・安価なシステムです。

波長範囲	380~850nm (標準)	250~950nm (紫外オプション)	800~1700nm (近赤外オプション)
分光器	2048 素子 CCD 分光器(電子冷却オプションあり)		256 素子 InGaAs 分光器
スポットサイズ	4mm (径)		
測定時間	1 秒		
精度	0.1nm		
分解能	1.5nm		
ソフトウェア	膜厚、屈折率 n ・減衰係数 k (オプション:透過、反射、色測定)		
ステージ	10cm x 10cm 手動 XY ステージ(標準)、自動 XY ステージ(オプション) 曲面測定ステージ(オプション)、40cm x 40cm 手動 XY ステージ(オプション) 特注ステージも可能		
光源	タンゲステン:380~850nm(標準) キセノン:250~1050nm		
ファイバ・集光	径 200um ファイバ、1.5 インチ積分球		
表示	付属ノートパソコン		
インターフェース	16 ビット、USB2.0		
価格	¥1,750,000	価格はお問い合わせください	

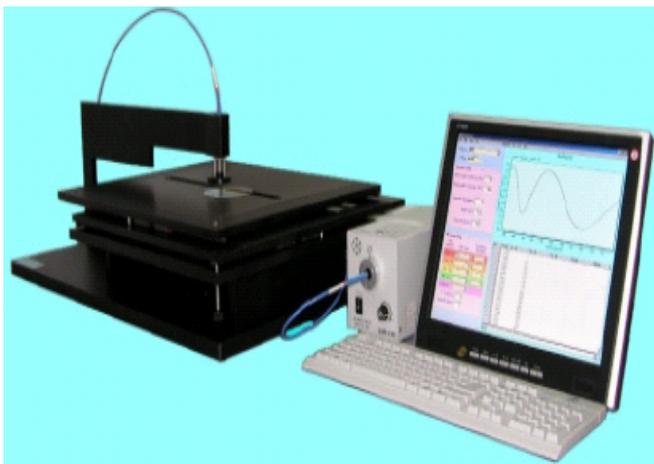
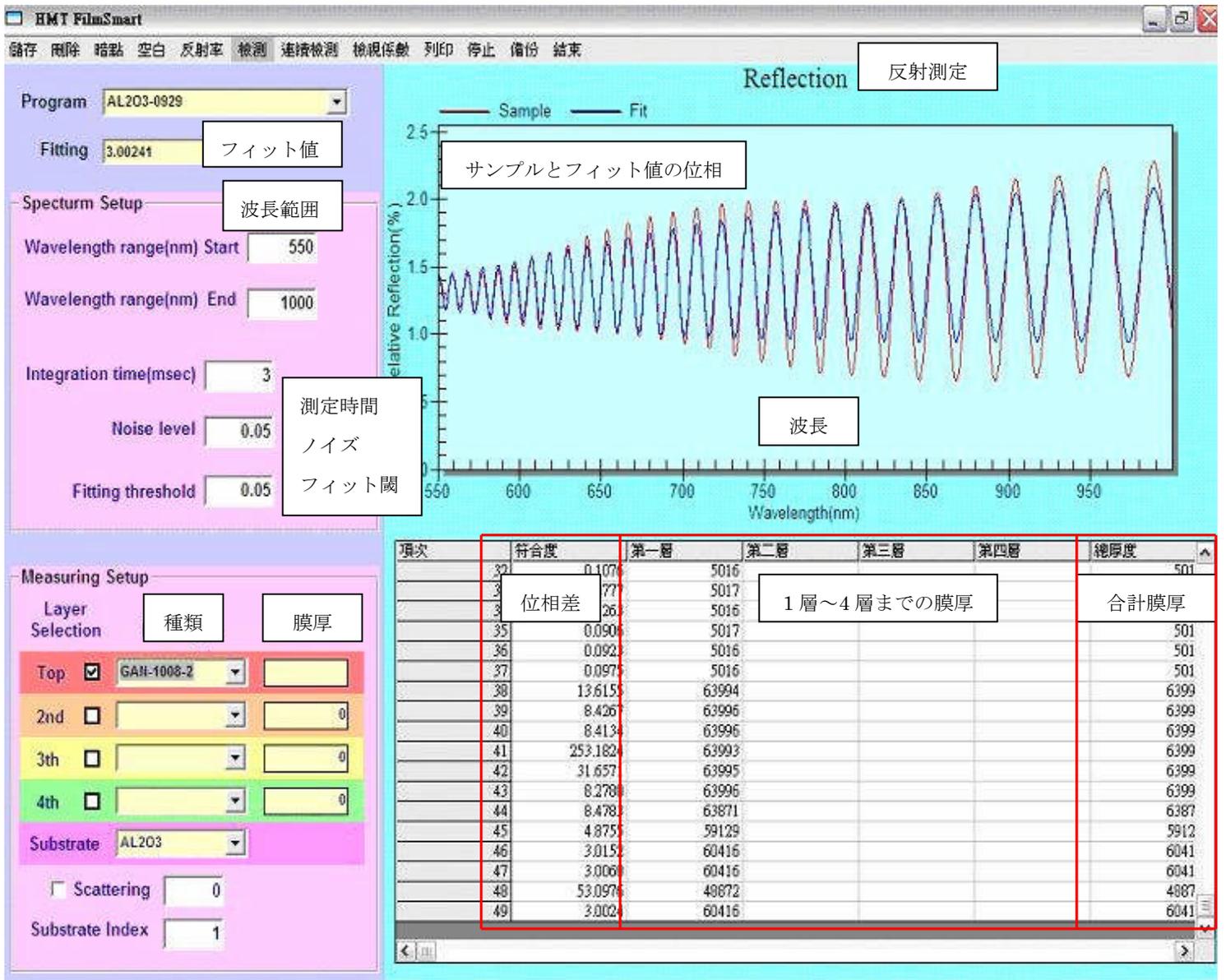


有限会社 たきぶん

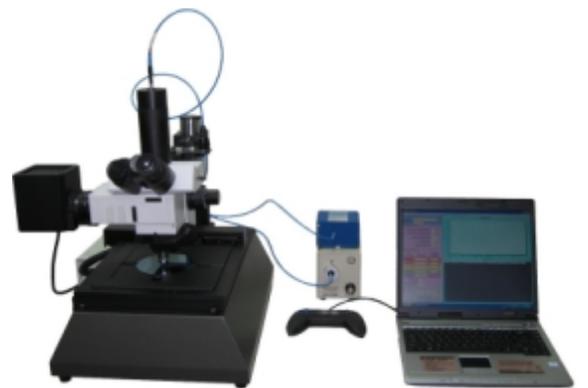
製品のお問い合わせは

TEL:03-6411-5320 FAX:03-6411-5319

Email:sales@takibun.jp



40x40cm 手動ステージ



顕微マイクロスポット 膜厚測定



有限会社 たきぶん

製品のお問い合わせは

TEL:03-6411-5320 FAX:03-6411-5319

Email:sales@takibun.jp